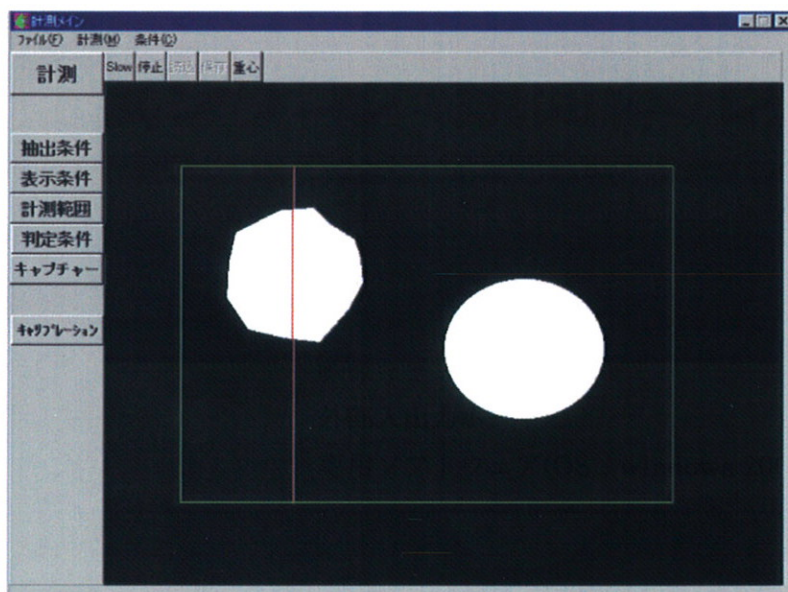


画期的な方式を開発

LZ-2001

金属シリコン(鏡面体)レベル計



左図は、レーザー受像器に投影されたレーザースポットの想定画像です。この受像スポットの位置をリアルタイムに測定することで簡単にシリコン表面のレベルを測定できます。

概要 これまで困難とされた熔融金属シリコンの表面高さレベル計を開発しました。鏡面の波状レベルを、リアルタイムに測定し、データをグラフ化、CRT表示の他外部にアナログ出力します。

装置の主な仕様

センサー部	レーザー装置	50mWクラス/スポットレーザー
	レーザー受像器	
	カメラ装置	41万画素モノクロCCDカメラ 望遠レンズ

いずれも耐熱ジャケットに収納/別置き型

処理部	DOS-V パソコン
	映像キャプチャーボード
	外部入出力ボード
	専用ソフトウェア(OS : windows 2000)

本装置は、客先仕様によりシステムが異なります。必要な詳しい情報を得て、システム化し、お見積もりできます。お問い合わせください。

株式会社セキュリティージャパン
〒135-0016 東京都江東区東陽 5-13-12
電話 03-3647-4545 FAX 03-3647-4585
<http://www.security-japan.com>